



КВК.ДИЦ.Э-16-001

### Назначение

Измеритель статических и динамических параметров микросхем КВК.ДИЦ.Э-16-001 предназначен для измерения статических и динамических параметров цифровых ИМС в условиях серийного производства. Возможность работы в едином измерительно - испытательном комплексе с автоматическими загрузчиками и климатическим испытательным оборудованием (сортировщики, проходные камеры и т.д.).

### Особенности

- ✓ Высокоинтегрированная системная база ведущих мировых производителей;
- ✓ Малая потребляемая мощность;
- ✓ Высокие метрологические характеристики.

#### Характеристики

Ед.изм. КВК.ДИЦ.Э-16-001

Характеристики	Ед.изм.	КВК.ДИЦ.Э-16-001
Диапазон периода следования импульсов генератора	нс	20 ± 100•103
Погрешность задания периода	нс	± 0,01 t <sub>n</sub> + 1
Диапазон задержки импульсов генератора фаз	нс	0,5 ÷ 99999
Дискретность задания задержки	нс	± 0,01 t <sub>z</sub> + 0,5
Погрешность задания задержки	нс	0,2
Диапазон длительности импульсов фаз	нс	10 ÷ 99999
Дискретность задания длительности импульса	нс	0,2
Погрешность задания длительности	нс	± 0,01 t <sub>d</sub> + 0,5
Количество фаз генератора импульсов	шт	3
Диапазон задержки генератора стробов	нс	0,5 ÷ 99999
Дискретность задания задержки стробов	нс	0,1
Погрешность задания задержки стробов	нс	± 0,01 t <sub>z</sub> + 0,5
Количество каналов стробов	шт	2
Частота генератора произвольных последовательностей	МГц	50
Емкость памяти хранения информации, переключения (вход/выход) и маскирования на каждом выводе	бит	1/0 256K (1M)
Диапазон напряжений, задаваемых драйвером	В	-0,5 ÷ 6,5
Погрешность задания уровней драйвером	мВ	± 1% +10
Разброс положения выходных сигналов между выводами	нс	±1
Диапазон контролируемых уровней компаратором	В	-0,5 ÷ +6,5
Погрешность контроля компаратора, не более	мВ	±1% +10

\*Внешний вид оборудования и некоторые характеристики могут отличаться от представленных здесь



КВК.ФИЦ.Э-50

### Назначение

Универсальная система контроля цифровых СБИС и БИС при разработке, контроле параметров в производстве и входном контроле у потребителей микросхем. Система обеспечивает контроль статических (только статические для КВК.СИЦ.Э-45) параметров и динамического функционирования БИС и СБИС, включая микропроцессоры, ПЛИС, МАБИС, EPROM и другие цифровые микросхемы.

### Особенности

- ✓ Высокоинтегрированная системная база ведущих мировых производителей;
- ✓ Наличие режима «math» (запуск теста по совпадению выходной информации СБИС с заданной);
- ✓ Малая потребляемая мощность;
- ✓ Высокие метрологические характеристики.

#### Характеристики

Ед.изм. КВК.ФИЦ.Э-50

Характеристики	Ед.изм.	КВК.ФИЦ.Э-50
Количество выводов контролируемых микросхем, шт.	шт	64
Частота контроля динамического функционирования, (при мультиплексировании 100 МГц)	МГц	до 50
Количество фаз шт	шт	16
Количество стробов, шт	шт	8
Период тактовых импульсов (синхронизации)		20 нс - 100 мкс
Период тактовых импульсов с дискретностью	нс	1
Дискретность программирования длительности фаз и стробов	нс	0,2
Минимальная длительность импульсов фаз	нс	5
Диапазон задания уровней драйверов и компараторов	В	0,5 ÷ 6,5
Дискретность задания	мВ	2,5
Погрешность задания и сравнения	мВ	±1% + 10
Входной ток компараторов, не более	мкА	1
Скорость нарастания фронтов драйвера	нс/В	0,8
Разброс фронтов драйвера, не более	нс	±1
Объем памяти канала для хранения тестовых последовательностей	М	4x1
Объем памяти ошибок, бит/канал	бит/канал	256
Количество источников/измерителей	шт	7
Диапазон задания (контроля) напряжения	В	±20
Диапазон задания (контроля) тока	мкА	±0,01 -200
Мощность потребляемая системой	кВт	1
Электропитание:		
- сеть переменного тока	В	220±10%
- частота, Гц	Гц	50

\*Внешний вид оборудования и некоторые характеристики могут отличаться от представленных здесь